

# 顕微鏡学会SPM分科学会

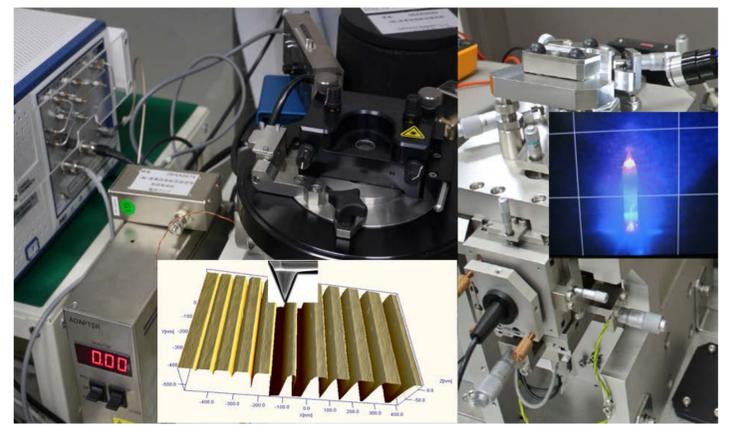
## 第35回産総研計測フロンティア研究部門セミナー ーグリーンエレクトロニクス材料・デバイスのSPM解析技術ー

### 微細構造解析プラットフォーム地域セミナー

日時 平成27年3月19日 (木)

会場 物質・材料研究機構 (NIMS) 千現地区研究本館第2会議室  
〒305-0047 茨城県つくば市千現1-2-1

主催 日本顕微鏡学会 走査型プローブ顕微鏡分科会  
産業技術総合研究所 計測フロンティア研究部門  
AIST微細構造解析プラットフォーム  
NIMS微細構造解析プラットフォーム



● **見学会 : 11:00 ~ 12:00**

NIMSナノテクプラットフォーム見学

● **講演会 : 13:20 ~ 17:30**

13:20~13:25 開会

13:25~13:40 微細構造解析プラットフォームの紹介

物質・材料研究機構 藤田 大介

13:40~13:50 リアル表面プローブ顕微鏡による支援の紹介

産業技術総合研究所 井藤 浩志

13:50~14:30 液中周波数変調原子間力顕微鏡を用いた  
固液界面プロセスの原子スケール解析

金沢大学 福間 剛士

14:30~15:05 高速原子間力顕微鏡を用いたレジスト現像過程の観察

株式会社EUVL基盤開発センター 七里 元晴

15:20~16:00 有機薄膜トランジスタの局所電子物性評価

京都大学 小林 圭

16:00~16:35 SiC上グラフェンのナノ物性評価

徳島大学 永瀬 雅夫

16:35~17:00 グラフェンの局所電気特性の評価：マルチプローブ技術を中心として

大阪大学 久保 理

17:00~17:25 半導体微小領域のキャリア濃度計測における校正法と標準化

日産アーク 要素解析室 藤田 高弥

17:25~17:30 閉会

● **懇親会 : 17時45分~** (会費2,000円)

参加申し込み : [riif\\_info-ml@aist.go.jp](mailto:riif_info-ml@aist.go.jp) (当日の参加申し込みも可能です)